

Defekte auf matten Oberflächen finden

Für die Defekterkennung auf diffus reflektierenden Oberflächen bietet die INB Vision AG, ein Unternehmen der Micro-Epsilon Gruppe, das Messsystem surfaceCONTROL an. Dieses System arbeitet nach dem Verfahren der Streifenlichtprojektion. Damit können lokale Formfehler, wie Beulen und Dellen in Oberflächen erkannt und analysiert werden, die nur wenige Mikrometer vom Sollmaß abweichen. Auch genarbte Oberflächen, wie bei Interieurteilen von Automobilen üblich werden damit zuverlässig bewertet.

surfaceCONTROL bietet verschiedene Messflächen in der Größe von ca. 150x100 mm² bis ca. 600x400 mm² und erfasst innerhalb weniger Sekunden die 3D-Daten der Oberfläche. Für die Auswertung stehen je nach Ausprägung der gesuchten Formabweichungen verschiedene Verfahren zur Verfügung. So kann für einen Vergleich aus den 3D-Daten eine fehlerfreie virtuelle Hülle berechnet und oder in Analogie zum Abziehstein in Presswerken ein digitaler Abziehstein eingesetzt werden. Diese Verfahren bieten die Möglichkeit einer reproduzierbaren, objektiven Bewertung von Abweichungen.

Das Streifenlichtprojektionsverfahren eignet sich für alle Flächen, die mindestens einen Teil des Lichtes diffus reflektieren. Das sind z.B. Stahl, Aluminium, Kunststoffe oder Keramik. Bei spiegelnden Objekten wird mit dem System reflectCONTROL von Micro-Epsilon auf das Messprinzip der Deflektometrie zurückgegriffen.

Ca. 1500 Zeichen



Micro-Epsilon Messtechnik

presse@micro-epsilon.com
Tel.: +49/8542/168-0
www.micro-epsilon.com

Weitere Informationen:
www.micro-epsilon.de/presse

(PR246_surfaceCONTROL.jpg)